



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LARGA DURACIÓN: METROLOGÍA EN QUÍMICA 2025

<u>Clave</u>	<u>Nombre del curso</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Duración en horas</u>	<u>Horario</u>	<u>Fecha de inicio</u>	<u>Fecha de término</u>	<u>Precio antes de IVA</u>
CP12-25	Metrología química para análisis de gases	Presencial	24	09h00 a 17h00	02 de abril	04 de abril	\$ 9,600.00
CP43-25	Metrología en química, trazabilidad metrológica y calibración externa en mediciones analíticas con técnicas espectrométricas e incertidumbre de medida	Presencial	24	09h00 a 17h00	09 de julio	11 de julio	\$ 9,600.00
CP92-25	Metrología en química, trazabilidad metrológica y calibración externa en mediciones analíticas con técnicas espectrométricas e incertidumbre de medida	En línea	20	09h30 a 14h30	25 de noviembre	28 de noviembre	\$ 8,000.00

CP28-25	Calificación de equipo de instrumentos de mediciones analíticas (CEIMA) y confirmación metrológica (CM) en mediciones químicas, fisicoquímicas y físicas	Presencial	24	09h00 a 17h00	03 de junio	05 de junio	\$ 9,600.00
CP44-25	Calificación de equipo de instrumentos de mediciones analíticas (CEIMA) y confirmación metrológica (CM) en mediciones químicas, fisicoquímicas y físicas	En línea	16	09h30 a 13h30	15 de julio	18 de julio	\$ 6,400.00
CP73-25	Calificación de equipo de instrumentos de mediciones analíticas (CEIMA) y confirmación metrológica (CM) en mediciones químicas, fisicoquímicas y físicas	Presencial	24	09h00 a 17h00	07 de octubre	09 de octubre	\$ 9,600.00
CP46-25	Validación de métodos analíticos en química cuantitativa	Presencial	24	09h00 a 17h00	16 de julio	18 de julio	\$ 9,600.00
CP88-25	Validación de métodos analíticos en química cuantitativa	En línea	20	09h30 a 14h30	11 de noviembre	14 de noviembre	\$ 8,000.00
CP16-25	Metrología en la aplicación de espectrometría de fluorescencia por rayos X	En línea	8	09h30 a 13h30	10 de abril	11 de abril	\$ 3,200.00
CP79-25	Metrología en la aplicación de difracción de rayos X	En línea	8	09h30 a 13h30	23 de octubre	24 de octubre	\$ 3,200.00
CP96-25	Metrología en la aplicación de microscopia electrónica de barrido ambiental (herramienta de dispersión de rayos X)	Presencial	16	09h00 a 17h00	04 de diciembre	05 de diciembre	\$ 6,400.00
CP32-25	Metrología en métodos gravimétricos, volumétricos y electroquímicos para análisis químico	Presencial	16	09h00 a 17h00	12 de junio	13 de junio	\$ 6,400.00
CP35-25	Metrología en métodos gravimétricos, volumétricos y electroquímicos para análisis químico	En línea	16	09h00 a 17h00	19 de junio	20 de junio	\$ 6,400.00
CP59-25	Aplicación de NMX-EC-17034-IMNC-2018 (ISO 17034:2016) y NMX-CH-165-IMNC-2008 (ISO Guide 35:2017) en materiales de referencia para mediciones inorgánicas	Presencial	40	09h00 a 17h00	01 de septiembre	05 de septiembre	\$ 16,000.00
CP84-25	Calidad del producto en mediciones de hidrocarburos líquidos	En línea	12	09h30 a 13h30	04 de noviembre	06 de noviembre	\$ 4,800.00
CP02-25	Análisis de compuestos orgánicos por espectrometría de masas acoplado a cromatografía de gases	Presencial	16	09h00 a 17h00	17 de febrero	18 de febrero	\$ 6,400.00

CP54-25	Análisis de compuestos orgánicos por espectrometría de masas acoplado a cromatografía de gases	En línea	10	09h30 a 14h30	12 de agosto	13 de agosto	\$ 4,000.00
CP98-25	Metrología de espectroscopia de infrarrojo y Raman en la caracterización de materiales	En línea	12	09h30 a 13h30	09 de diciembre	11 de diciembre	\$ 4,800.00

Mayores informes en: educontinua@cenam.mx

* Los cursos en la modalidad presencial se imparten en las instalaciones del CENAM:

<https://www.cenam.mx/visitante/default.aspx>

* Los cursos en la modalidad en línea se imparten a través de la plataforma de Microsoft Teams

* Se sugiere revisar el proceso de inscripción y temarios en: <https://www.cenam.mx/cursos/>

* El precio de los cursos no incluyen el 16% del IVA

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso. Se recomienda consultar actualizaciones en: <https://www.cenam.mx/cursos/>

Para acreditar el programa de capacitación de larga duración se debe asistir, como mínimo, a diez cursos en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha del primer curso al que asista.